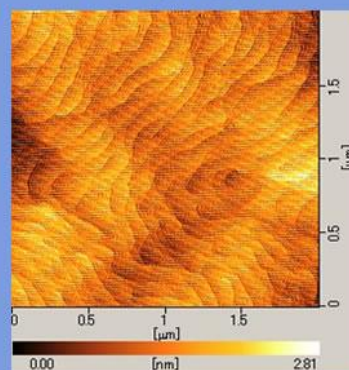


窒化物半導体エピタキシャルウエハ ～検査データ例～

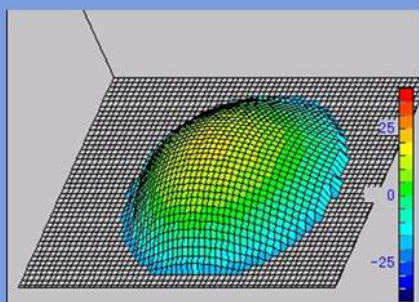
NTT-ATならお客様のご要望に応じて、様々な製品検査データを提供できます。

- 膜厚分布
- 組成分布
- シート抵抗分布
- 移動度分布
- AFM
- ウエハ形状 (SORI)
- 表面検査 (パーティクル検査)
- XRDフィッティング
- C-Vキャリア濃度プロファイル
- ...その他

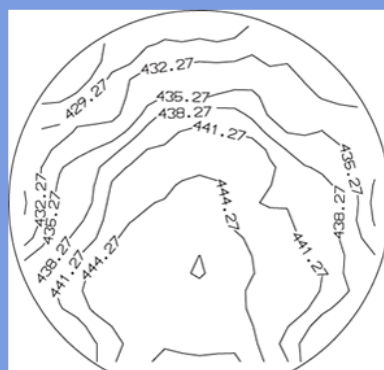
AFM観察例



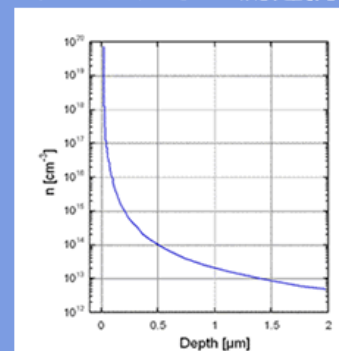
ウエハ形状測定例



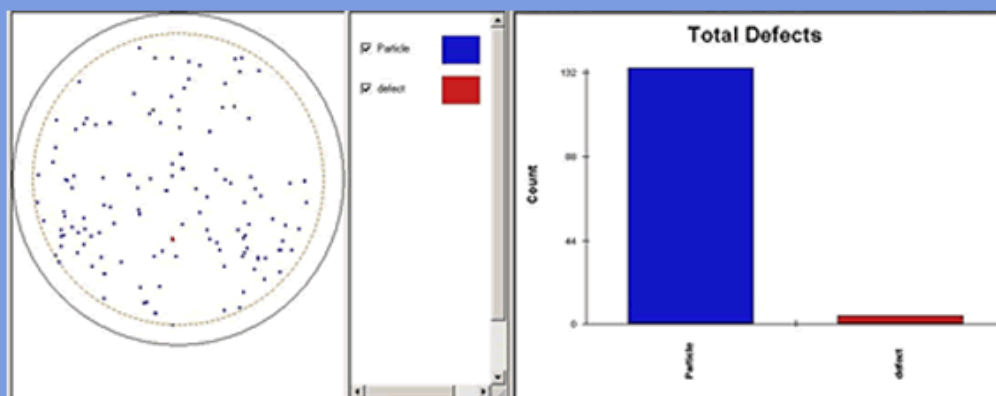
シート抵抗分布測定例



キャリア濃度
プロファイル測定例



表面検査評価例



※本カタログ記載の内容は予告なく変更されることがあります。

●お問い合わせ先

NTTアドバンステクノロジー株式会社

グローバル事業本部 プロダクトインキュベーションセンタ

〒243-0124 神奈川県厚木市森の里若宮3-1 NTT厚木研究開発センタ内

TEL : 046-250-3682 FAX : 046-250-3871

<http://www.keytech.ntt-at.co.jp/>